(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-299441 (P2002-299441A)

(43)公開日 平成14年10月11日(2002.10.11)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		7	-7]-ド(参考)
H01L	21/768 21/312 21/316		H01L	21/312		5 F O 3 3
				21/316	M	5 F 0 5 8
				21/90	J	

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 13 頁)

(21) 出願番号 特願2001-101186(P2001-101186) (71) 出願人 000004178 ジェイエスアール株式会社 東京都中央区築地2丁目11番24号 (72)発明者 塩田 淳 東京都中央区築地二丁目11番24号ジェイエ

スアール株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 デュアルダマシン構造の形成方法

(57)【要約】

【課題】 半導体の配線形成に好適なデュアルダマシン構造の形成方法を提供する。

【解決手段】 無機系絶縁膜上に有機系絶縁膜および 金属酸化物膜を形成した積層構造に、パターン形成し、 エッチングすることを特徴とするデュアルダマシン構造 の形成方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 無機系絶縁膜上に有機系絶縁膜および金属酸化物膜を積層する工程を含むことを特徴とするデュアルダマシン構造の形成方法。

【請求項2】 無機系絶縁膜内にミッドエッチストッパー層を有することを特徴とする請求項1記載のデュアルダマシン構造の形成方法。

【請求項3】 無機系絶縁膜が比誘電率1.5~3.2のシロキサン系絶縁膜であることを特徴とする請求項1のデュアルダマシン構造の形成方法。

【請求項4】 比誘電率1.5~3.2のシロキサン系絶縁膜が炭化水素基を有することを特徴とする請求項3記載のデュアルダマシン構造の形成方法。

【請求項5】 有機系絶縁膜がガラス転移点が400℃以上、熱分解温度が500℃以上の有機ポリマーであることを特徴とする請求項1のデュアルダマシン構造の形成方法。

【請求項6】 有機ポリマーがポリアリーレン、ポリアリーレンエーテル、ポリベンゾオキサゾール、ポリイミドより選ばれる事を特徴とする請求項5記載のデュアルダマシン構造の形成方法。

【請求項7】 金属酸化物膜層が、B、A1、Ga、In、T1、Si、Ge、Sn、Pb、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Mn、Zn、Cd、P、As、Sb、Bi、Ceより選ばれる少なくとも一種類の金属の酸化物であることを特徴とする請求項1のデュアルダマシン構造の形成方法。

【請求項8】 金属酸化物層が反射防止能を有することを特徴とする請求項1のデュアルダマシン構造の形成方法。

【請求項9】 無機系絶縁膜をポリシロキサンおよび有機溶媒からなる塗布液を塗布し、加熱することより形成することを特徴とする請求項1記載のデュアルダマシン構造の形成方法。

【請求項10】 有機系絶縁膜をガラス転移点が400℃以上、熱分解温度が500℃以上の有機ポリマーおよび有機溶剤からなる塗布液を塗布し、加熱することにより形成することを特徴とする請求項1記載のデュアルダマシン構造の形成方法。

【請求項11】 金属酸化物膜をB、AI、Ga、In、TI、Si、Ge、Sn、Pb、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Mn、Zn、Cd、P、As、Sb、Bi、Ceより選ばれる少なくとも一種類の金属のアルコキシドを加水分解し、縮合して得られる化合物と有機溶媒からなる塗布液を塗布し、加熱することにより形成することを特徴とする請求項1記載のデュアルダマシン構造の形成方法。

【請求項12】 請求項1~11のいずれかに記載の方法により形成されたデュアルダマシン構造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体装置の配線 形成に関し、詳しくは、半導体の配線形成に好適なデュ アルダマシン構造およびその形成方法に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体装置の微細化にともない、配線材 料を従来のアルミから銅へ転換する動きが進展してい る。銅を配線材料として用いる場合、ダマシン法が用い られることが多く、その中でもビア配線とトレンチ配線 を同時に形成できるデュアルダマシン法は、半導体装置 の製造コストを低減できるので好ましい手法と見られて いる。現在、シリカを絶縁膜とする配線構造において、 このデュアルダマシン法によって形成される銅配線技術 が一般に普及しつつある。そして半導体装置のさらなる 微細化要求において、配線材料ばかりでなく、絶縁材料 を現行のシリカ(比誘電率4)からより低誘電な材料へ 切り替える検討も活発化している。このような低誘電材 料としては、通常のシリカにフッ素原子を加えたフッ素 ドープシリカ、CVD法炭素含有シリカ膜、塗布型有機絶 縁膜、塗布型シロキサン系膜などが挙げられる。一方、 デュアルダマシンの形成方法としては、いくつかの方法 が挙げられる。ビアファースト法、トレンチファースト 法、埋め込みハードマスク法(Buried Hardmask)、デュ アルハードマスク法などである。通常のシリカまたはフ ッ素ドープシリカを絶縁材料として用いる場合、マスク アライメントの容易さ、総工程数からビアファースト法 が専ら用いられている。ビアファースト法では、まず、 ビアパターンを絶縁膜へ形成し、その後、フォトレジス トまたは反射防止材料を形成したビアへ埋め込み、トレ ンチを形成した後、ビアへ埋め込まれたフォトレジスト や反射防止材料の残さを、酸素プラズマ、または、強ア ミンをベースとするウエット剥離液などを用いて除去す る。このため、低誘電率膜は、ビアに埋め込まれたレジ ストまたは反射防止膜残さを除去する際に用いる。プラ ズマまたは強力なウエット剥離液によるダメージが避け られないという問題点がある。トレンチファーストの場 合にも同じ問題点を有する。また、埋め込みハードマス ク法では、上記のような問題点は無いが、成膜工程とリ ソグラフィー工程を何度も往復するため、製造コストが 高くなるという問題点を有する。この点、デュアルレイ ヤーハードマスク法は、これらの欠点を補う方法とし て、低誘電材料を絶縁膜として用いるデュアルダマシン 形成における有力な方法として見られている。

【0003】現在では、デュアルレイヤーハードマスク法を用いてデュアルダマシンを形成する際には、CVD法の炭化珪素、窒化珪素およびシリカ膜から選ばれる2種類を組み合わせる方法が考えられている。しかし、全てが珪素を含む膜であり、各レイヤー間のエッチング選択比を確保し、形状良くデュアルダマシン構造を形成するのが困難であるという問題点がある。また、この方法を

塗布系の材料と組み合わせた場合には、塗布系成膜装置 とCVD系成膜装置をシリコンウエハーが往復するので、 工程フローが複雑になるという問題点も有する。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題を 解決するために、新たなデュアルダマシン構造の形成方 法を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、無機系絶縁膜 上に有機系絶縁膜および金属酸化物膜層を積層する工程 を含むことを特徴とするデュアルダマシン構造の形成方 法およびその方法で形成されたデュアルダマシン構造を 提供するものである。

無機系絶縁膜層

本発明において無機系絶縁膜層としては、シリカ、炭化 水素基を有するポリシロキサンが好ましい。これらのシ

$$(3)$$
 $(R^4 O)_{3-b} Si - (R^7)_{3-b}$

〔式中、 $R^3 \sim R^6$ は同一または異なり、それぞれ1価 の有機基、bおよびcは同一または異なり、0~2の数 を示し、 R^7 は酸素原子、フェニレン基または- (CH $_2$) $_n$ ーで表される基(ここで、 $_n$ は $1\sim$ 6の整数であ る)、dは0または1を示す。〕を挙げることができ

【0006】化合物(1);上記一般式(1)におい て、RおよびR1の1価の有機基としては、アルキル 基、アリール基、アリル基、グリシジル基などを挙げる ことができる。また、一般式(1)において、Rは1価 の有機基、特にアルキル基またはフェニル基であること が好ましい。ここで、アルキル基としては、メチル基、 エチル基、プロピル基、ブチル基などが挙げられ、好ま しくは炭素数1~5であり、これらのアルキル基は鎖状 でも、分岐していてもよく、さらに水素原子がフッ素原 子などに置換されていてもよい。一般式(1)におい て、アリール基としては、フェニル基、ナフチル基、メ チルフェニル基、エチルフェニル基、クロロフェニル 基、プロモフェニル基、フルオロフェニル基などを挙げ ることができる。

【0007】化合物(1)の具体例としては、トリメト キシシラン、トリエトキシシラン、トリーnープロポキ シシラン、トリーisoープロポキシシラン、トリーn ーブトキシシラン、トリーsec-ブトキシシラン、ト リーtert-ブトキシシラン、トリフェノキシシラ ン、フルオロトリメトキシシラン、フルオロトリエトキ シシラン、フルオロトリーn-プロポキシシラン、フル オロトリーiso-プロポキシシラン、フルオロトリー n-ブトキシシラン、フルオロトリーsec-ブトキシ シラン、フルオロトリーtert-ブトキシシラン、フ ルオロトリフェノキシシランなど;

【0008】メチルトリメトキシシラン、メチルトリエ

リカまたは炭化水素基を有するポリシロキサンからなる 無機系絶縁膜層はCVD法で形成することもできるが、 塗布液を用いて形成することが好ましい。無機系絶縁膜 層形成用塗布液は、(A)ポリシロキサン(B)および 有機溶媒からなる。ここで、ポリシロキサンとしては (A)下記一般式(1)で表される化合物(以下、「化 合物(1)」という)、下記一般式(2)で表される化 合物(以下、「化合物(2)」という)および下記一般 式(3)で表される化合物(以下、「化合物(3)」と いう) の群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物 を加水分解し、縮合した加水分解縮合物 R_a Si $(OR^1)_{4-a}$ (1) (式中、Rは水素原子、フッ素原子または1価の有機 基、R1 は1価の有機基、aは1~2の整数を示す。) $Si(OR^2)_4$ $\cdots (2)$

(式中、R² は1価の有機基を示す。) $R^3_{\ b}$ (R4 O) $_{\mbox{\scriptsize 3-b}}$ Si-(R7) $_{\mbox{\scriptsize d}}$ -Si(OR5) $_{\mbox{\scriptsize 3-c}}$ R6 $_{\mbox{\scriptsize c}}$

> トキシシラン、メチルトリーnープロポキシシラン、メ チルトリー i s o ープロポキシシラン、メチルトリー n ーブトキシシラン、メチルトリーsec-ブトキシシラ ン、メチルトリーtert-ブトキシシラン、メチルト リフェノキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチ ルトリエトキシシラン、エチルトリーn-プロポキシシ ラン、エチルトリーiso-プロポキシシラン、エチル トリーnーブトキシシラン、エチルトリーsecーブト キシシラン、エチルトリーtert-ブトキシシラン、 エチルトリフェノキシシラン、ビニルトリメトキシシラ ン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリーnープロ ポキシシラン、ビニルトリーiso-プロポキシシラ ン、ビニルトリーn-ブトキシシラン、ビニルトリーs ec-ブトキシシラン、ビニルトリーtert-ブトキ シシラン、ビニルトリフェノキシシラン、n-プロピル トリメトキシシラン、nープロピルトリエトキシシラ ン、nープロピルトリーnープロポキシシラン、nープ ロピルトリーisoープロポキシシラン、nープロピル トリーnーブトキシシラン、nープロピルトリーsec ープトキシシラン、nープロピルトリーtertーブト キシシラン、nープロピルトリフェノキシシラン、i-プロピルトリメトキシシラン、i-プロピルトリエトキ シシラン、i -プロピルトリーn-プロポキシシラン、 i-プロピルトリーiso-プロポキシシラン、i-プ ロピルトリーnーブトキシシラン、iープロピルトリー secーブトキシシラン、iープロピルトリーtert ープトキシシラン、i ープロピルトリフェノキシシラ ン、n-ブチルトリメトキシシラン、n-ブチルトリエ トキシシラン、nーブチルトリーnープロポキシシラ ン、n-ブチルトリ-iso-プロポキシシラン、n-ブチルトリーn-ブトキシシラン、n-ブチルトリ-s ec-ブトキシシラン、n-ブチルトリーtert-ブ

トキシシラン、nーブチルトリフェノキシシラン、se cーブチルトリメトキシシラン、secーブチルトリエ トキシシラン、sec-ブチルートリーn-プロポキシ シラン、sec-ブチルートリーiso-プロポキシシ ラン、sec-ブチルートリーn-ブトキシシラン、s ecーブチルートリーsecーブトキシシラン、sec ーブチルートリーtert-ブトキシシラン、sec-ブチルートリフェノキシシラン、セーブチルトリメトキ シシラン、t-ブチルトリエトキシシラン、t-ブチル トリーnープロポキシシラン、tーブチルトリーiso ープロポキシシラン、t-ブチルトリーn-ブトキシシ ラン、t-ブチルトリーsec-ブトキシシラン、t-ブチルトリーtertーブトキシシラン、tーブチルト リフェノキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フ ェニルトリエトキシシラン、フェニルトリーnープロポ キシシラン、フェニルトリーiso-プロポキシシラ ン、フェニルトリーnーブトキシシラン、フェニルトリ ーsecーブトキシシラン、フェニルトリーtert-ブトキシシラン、フェニルトリフェノキシシラン、ビニ ルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ア ーアミノプロピルトリメトキシシラン、アーアミノプロ ピルトリエトキシシラン、ケーグリシドキシプロピルト リメトキシシラン、 γ ーグリシドキシプロピルトリエト キシシラン、ァートリフロロプロピルトリメトキシシラ ン、 γ -トリフロロプロピルトリエトキシシランなど; 【0009】ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジェ トキシシラン、ジメチルージーnープロポキシシラン、 ジメチルージーiso-プロポキシシラン、 ジメチルー ジーnーブトキシシラン、ジメチルージーsecーブト キシシラン、ジメチルージーtert-ブトキシシラ ン、ジメチルジフェノキシシラン、ジエチルジメトキシ シラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチルージーn ープロポキシシラン、ジエチルージー i soープロポキ シシラン、ジエチルージーn-ブトキシシラン、ジエチ ルージーsecーブトキシシラン、ジエチルージーte rtーブトキシシラン、ジエチルジフェノキシシラン、 ジーnープロピルジメトキシシラン、ジーnープロピル ジエトキシシラン、ジーn-プロピル-ジーn-プロポ キシシラン、ジーn-プロピル-ジ-iso-プロポキ シシラン、ジーnープロピルージーnーブトキシシラ ン、ジーnープロピルージーsec-ブトキシシラン、 ジーnープロピルージーtertーブトキシシラン、ジ ーn-プロピルージーフェノキシシラン、ジーiso-プロピルジメトキシシラン、ジーiso-プロピルジエ トキシシラン、ジーisoープロピルージーnープロポ キシシラン、ジーiso-プロピルージーiso-プロ ポキシシラン、ジーiso-プロピルージーn-ブトキ シシラン、ジーiso-プロピルージーsec-ブトキ シシラン、ジーisoープロピルージーtert-ブト キシシラン、ジーiso-プロピルージーフェノキシシ

ラン、ジーnーブチルジメトキシシラン、ジーnーブチ ルジエトキシシラン、ジーn-ブチル-ジーn-プロポ キシシラン、ジーn-ブチル-ジ-iso-プロポキシ シラン、ジーn-ブチル-ジ-n-ブトキシシラン、ジ ーnーブチルージーsecーブトキシシラン、ジーn-ブチルージーtertーブトキシシラン、ジーnーブチ ルージーフェノキシシラン、ジーsec-ブチルジメト キシシラン、ジーsecーブチルジエトキシシラン、ジ -sec-ブチルージーn-プロポキシシラン、ジーs e c ープチルージーisoープロポキシシラン、ジーs ecーブチルージーnーブトキシシラン、ジーsecー ブチルージーsec-ブトキシシラン、ジーsec-ブ チルージーtert-ブトキシシラン、ジーsec-ブ チルージーフェノキシシラン、ジーtert-ブチルジ メトキシシラン、ジーtert-ブチルジエトキシシラ ン、ジーtert-ブチルージーn-プロポキシシラ ン、ジーtert-ブチルージーiso-プロポキシシ ラン、ジーtert-ブチル-ジーn-ブトキシシラ ン、ジーtertーブチルージーsecープトキシシラ ン、ジーtertーブチルージーtertーブトキシシ ラン、ジーtertーブチルージーフェノキシシラン、 ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルージーエトキ シシラン、ジフェニルージーnープロポキシシラン、ジ フェニルージーiso-プロポキシシラン、ジフェニル ージーn-ブトキシシラン、ジフェニルージーsec-ブトキシシラン、ジフェニルージーtert-ブトキシ シラン、ジフェニルジフェノキシシラン、ジビニルトリ メトキシシランなど;を挙げることができる。

【0010】化合物(1)として好ましい化合物は、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリーiso一プロボキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジエチルジメトキシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルジストキシシラン、ジフェニルジストキシシラン、ジフェニルジストキシシラン、ジフェニルジストキシシラン、ジフェニルジストキシシラン、ジフェニルジストキシシラン、ジフェニルジエトキシランなどである。これらは、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

化合物 (2);上記一般式 (2)において、 R^2 で表される 1 価の有機基としては、先の一般式 (1)と同様な有機基を挙げることができる。化合物 (2)の具体例としては、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラーn-プロポキシシラン、テトラーn-ブトキシシラン、テトラーn-ブトキシシラン、テトラーn-ブトキシシラン、テトラーn-ブトキシシラン、テトラーn-ブトキシシラン、テトラーn-ブトキシシラン、テトラーn-ブトキシシラン、テトラーn-ブトキシシラン、テトラフェノキシシランなどが挙げられる。化合物 (3);上記一般式 (3)において、n-n-R6で表される 1 価の有機基としては、先の一般式 (1)と

同様な有機基を挙げることができる。化合物(3)のう ち一般式(3)における R^7 が酸素原子の化合物として は、ヘキサメトキシジシロキサン、ヘキサエトキシジシ ロキサン、ヘキサフェノキシジシロキサン、1,1, 1,3,3-ペンタメトキシ-3-メチルジシロキサ ン、1、1、1、3、3ーペンタエトキシー3ーメチル ジシロキサン、1,1,1,3,3-ペンタフェノキシ -3-メチルジシロキサン、1,1,1,3,3-ペン タメトキシー3ーエチルジシロキサン、1,1,1, 3,3-ペンタエトキシ-3-エチルジシロキサン、 1, 1, 1, 3, 3-ペンタフェノキシ-3-エチルジ シロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタメトキシ-3 ーフェニルジシロキサン、1,1,1,3,3ーペンタ エトキシー3-フェニルジシロキサン、1,1,1, 3,3-ペンタフェノキシ-3-フェニルジシロキサ ン、1,1,3,3-テトラメトキシー1,3-ジメチ ルジシロキサン、1,1,3,3-テトラエトキシー 1,3-ジメチルジシロキサン、1,1,3,3-テト ラフェノキシー1,3-ジメチルジシロキサン、1, 1,3,3-テトラメトキシ-1,3-ジエチルジシロ キサン、1,1,3,3-テトラエトキシー1,3-ジ エチルジシロキサン、1,1,3,3-テトラフェノキ シー1,3-ジエチルジシロキサン、1,1,3,3-テトラメトキシー1,3ージフェニルジシロキサン、 1, 1, 3, 3-テトラエトキシ-1, 3-ジフェニル ジシロキサン、1,1,3,3-テトラフェノキシー 1, 3-ジフェニルジシロキサン、1, 1, 3-トリメ トキシー1,3,3ートリメチルジシロキサン、1, 1,3-トリエトキシー1,3,3-トリメチルジシロ キサン、1,1,3ートリフェノキシー1,3,3ート リメチルジシロキサン、1,1,3-トリメトキシー 1, 3, 3-トリエチルジシロキサン、、1, 1, 3-トリエトキシー1,3,3-トリエチルジシロキサ ン、、1, 1, 3-トリフェノキシー1, 3, 3-トリ エチルジシロキサン、、1,1,3-トリメトキシー 1, 3, 3-トリフェニルジシロキサン、1, 1, 3-トリエトキシー1,3,3ートリフェニルジシロキサ ン、1,1,3-トリフェノキシ-1,3,3-トリフ ェニルジシロキサン、1,3-ジメトキシ-1,1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジエトキ シ-1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジフェノキシ-1,1,3,3-テトラメチルジシ ロキサン、1,3-ジメトキシ-1,1,3,3-テト ラエチルジシロキサン、1,3-ジエトキシ-1,1, 3, 3-テトラエチルジシロキサン、1, 3-ジフェノ キシー1,1,3,3ーテトラエチルジシロキサン、 1, 3-ジメトキシー1, 1, 3, 3-テトラフェニル ジシロキサン、1,3ージエトキシー1,1,3,3-テトラフェニルジシロキサン、1,3-ジフェノキシー 1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサンなどを挙

げることができる。

【0011】これらのうち、ヘキサメトキシジシロキサン、ヘキサエトキシジシロキサン、1,1,3,3-テトラメトキシー1,3-ジメチルジシロキサン、1,1,3,3-テトラエトキシー1,3-ジメチルジシロキサン、1,1,3,3-テトラメトキシー1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン、1,3-ジエトキシー1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン、1,3-ジメトキシー1,1,3,3-テトラフェニルジシロキサン、1,3-ジエトキシー1,1,3,3-テトラフェニルジシロキサン、1,3-ジエトキシー1,1,3,3-テトラフェニルジシロキサンなどを、好ましい例として挙げることができる。

【0012】また、一般式(3)において、dが0の化 合物としては、ヘキサメトキシジシラン、ヘキサエトキ シジシラン、ヘキサフェノキシジシラン、1,1,1, 2,2-ペンタメトキシ-2-メチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタエトキシー2-メチルジシラ ン、1, 1, 2, 2-ペンタフェノキシー2-メチ ルジシラン、1,1,1,2,2-ペンタメトキシー2 -エチルジシラン、1,1,1,2,2-ペンタエトキ シー2-エチルジシラン、1,1,1,2,2-ペンタ フェノキシー2-エチルジシラン、1,1,1,2,2 ーペンタメトキシー2ーフェニルジシラン、1,1, 1, 2, 2-ペンタエトキシー2-フェニルジシラン、 1, 1, 1, 2, 2-ペンタフェノキシー2-フェニル ジシラン、1,1,2,2-テトラメトキシー1,2-ジメチルジシラン、1,1,2,2-テトラエトキシー 1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラフ ェノキシー1,2-ジメチルジシラン、1,1,2,2 ーテトラメトキシー1,2ージエチルジシラン、1, 1,2,2-テトラエトキシ-1,2-ジエチルジシラ ン、1, 1, 2, 2-テトラフェノキシー1, 2-ジェ チルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメトキシー1,2-ジフェニルジシラン、1,1,2,2-テトラエト キシー1, 2ージフェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラフェノキシー1,2-ジフェニルジシラン、1, 1,2-トリメトキシー1,2,2-トリメチルジシラ ン、1,1,2-トリエトキシ-1,2,2-トリメチ ルジシラン、1,1,2-トリフェノキシー1,2,2 ートリメチルジシラン、1,1,2ートリメトキシー 1, 2, 2-トリエチルジシラン、、1, 1, 2-トリ エトキシー1,2,2-トリエチルジシラン、、1, 1,2-トリフェノキシ-1,2,2-トリエチルジシ ラン、、1,1,2-トリメトキシ-1,2,2-トリ フェニルジシラン、1,1,2-トリエトキシー1, 2, 2-トリフェニルジシラン、、1, 1, 2-トリフ ェノキシー1,2,2-トリフェニルジシラン、1,2 ージメトキシー1,1,2,2ーテトラメチルジシラ ン、1, 2-ジェトキシ-1, 1, 2, 2-テトラメチ

ルジシラン、1, 2-ジフェノキシ-1, 1, 2, 2- テトラメチルジシラン、1, 2-ジメトキシ-1, 1, 2, 2-テトラエチルジシラン、1, 2-ジエトキシ-1, 1, 2, 2-テトラエチルジシラン、1, 2-ジフェノキシ-1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシラン、1, 2-ジメトキシ-1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシラン、1, 2-ジフェノキシ-1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシラン、1, 2-ジフェノキシ-1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシランなどを挙げることができる。

【0013】これらのうち、ヘキサメトキシジシラン、ヘキサエトキシジシラン、1,1,2,2ーテトラメトキシー1,2ージメチルジシラン、1,1,2,2ーテトラエトキシー1,2ージメチルジシラン、1,1,2ーデトラメトキシー1,1,2,2ーテトラメトキシー1,1,2,2ーテトラメチルジシラン、1,2ージエトキシー1,1,2,2ーテトラメチルジシラン、1,2ージメトキシー1,1,2,2ーデトラスチルジシラン、1,2ージエトキシー1,1,2,2ーテトラフェニルジシラン、1,2ージエトキシー1,1,2,2ーテトラフェニルジシランなどを、好ましい例として挙げることができる。

【0014】さらに、一般式(3)において、R7 が-(CH₂)_nーで表される基の化合物としては、ビス (トリメトキシシリル) メタン、ビス (トリエトキシシ リル)メタン、ビス (トリーnープロポキシシリル)メ タン、ビス (トリー i ープロポキシシリル) メタン、ビ ス(トリーn-ブトキシシリル)メタン、ビス(トリー secーブトキシシリル) メタン、ビス (トリーセーブ トキシシリル) メタン、1,2-ビス(トリメトキシシ リル) エタン、1,2-ビス(トリエトキシシリル)エ タン、1,2-ビス(トリーn-プロポキシシリル)エ タン、1,2-ビス(トリーi-プロポキシシリル)エ タン、1,2-ビス(トリーn-ブトキシシリル)エタ ン、1,2-ビス(トリーsec-ブトキシシリル)エ タン、1,2-ビス(トリーt-ブトキシシリル)エタ ン、1-(ジメトキシメチルシリル)-1-(トリメト キシシリル) メタン、1 - (ジエトキシメチルシリル) -1-(トリエトキシシリル)メタン、1-(ジーn-プロポキシメチルシリル) -1-(トリーn-プロポキ シシリル) メタン、1 - (ジ-i-プロポキシメチルシ リル) -1-(トリーi-プロポキシシリル)メタン、 1-(ジ-n-ブトキシメチルシリル)-1-(トリn-ブトキシシリル) メタン、1-(ジ-sec-ブト キシメチルシリル) -1-(トリーsecーブトキシシ **リル)メタン、1-(ジ-t-ブトキシメチルシリル)** -1-(トリーt-ブトキシシリル)メタン、1-(ジ メトキシメチルシリル) -2-(トリメトキシシリル) エタン、1~(ジエトキシメチルシリル)-2-(トリ エトキシシリル) エタン、1 - (ジ-n-プロポキシメ チルシリル)-2-(トリ-n-プロポキシシリル)エ

9ン、1-(ジ-i-)ロポキシメチルシリル) -2-(トリーi-プロポキシシリル) エタン、1-(ジ-n ープトキシメチルシリル) -2-(トリーn-ブトキシ シリル) エタン、1-(ジ-sec-ブトキシメチルシ リル) -2-(トリーsec-ブトキシシリル) エタ ン、1 - (ジーt - ブトキシメチルシリル) - 2 - (ト リーセーブトキシシリル) エタン、ビス (ジメトキシメ チルシリル)メタン、ビス (ジエトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジーn-プロポキシメチルシリル) メタ ン、ビス(ジー i -プロポキシメチルシリル)メタン、 ビス (ジー n ープトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジーsec-ブトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジーt-ブトキシメチルシリル) メタン、1,2-ビ ス (ジメトキシメチルシリル) エタン、1, 2ービス (ジエトキシメチルシリル) エタン、1,2-ビス(ジ -n-プロポキシメチルシリル) エタン、1,2-ビス (ジーi-プロポキシメチルシリル)エタン、1,2-ビス (ジーn-ブトキシメチルシリル) エタン、1,2 ービス (ジーsecーブトキシメチルシリル) エタン 1,2-ビス(ジーt-ブトキシメチルシリル)エタ ン、1,2-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1, 2-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1,2・ ービス (トリーn-プロポキシシリル) ベンゼン、1, 2-ビス (トリーi-プロポキシシリル) ベンゼン、 1,2-ビス(トリーn-ブトキシシリル)ベンゼン、 1,2-ビス(トリーsec-ブトキシシリル)ベンゼ ン、1,2-ビス(トリ-t-ブトキシシリル)ベンゼ ン、1,3-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1,3-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1,3 ービス (トリーnープロポキシシリル) ベンゼン、1, 3ービス(トリーi-プロポキシシリル)ベンゼン、 1,3-ビス(トリーn-ブトキシシリル)ベンゼン、 1,3-ビス(トリーsec-ブトキシシリル)ベンゼ ン、1,3-ビス(トリーt-ブトキシシリル)ベンゼ ン、1,4-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1,4-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1,4 ービス (トリーnープロポキシシリル) ベンゼン、1, 4ービス (トリーiープロポキシシリル) ベンゼン、 1,4-ビス(トリーn-ブトキシシリル)ベンゼン、 1,4-ビス(トリーsec-ブトキシシリル)ベンゼ ン、1,4-ビス(トリーセーブトキシシリル)ベンゼ ンなど挙げることができる。 【0015】 これらのうち、 ビス (トリメトキシシリ

 $\{0015\}$ これらのうち、ビス(トリメトキシシリル)メタン、ビス(トリエトキシシリル)メタン、1, 2-ビス(トリメトキシシリル)エタン、1, 2-ビス(トリエトキシシリル)エタン、1-(ジメトキシメチルシリル)-1-(トリメトキシシリル)メタン、1-(ジエトキシメチルシリル)-1-(トリエトキシシリル)メタン、1-(ジメトキシメチルシリル)-2-(トリメトキシシリル)エタン、1-(ジエトキシメチ

ルシリル) -2- (トリエトキシシリル) エタン、ビス (ジメトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジエトキシメチルシリル) メタン、1, 2-ビス (ジメトキシメチルシリル) エタン、1, 2-ビス (ジエトキシメチルシリル) エタン、1, 2-ビス (トリメトキシシリル) ベンゼン、1, 2-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼン、1, 3-ビス (トリメトキシシリル) ベンゼン、1, 4-ビス (トリメトキシシリル) ベンゼン、1, 4-ビス (トリメトキシシリル) ベンゼン、1, 4-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼン、1, 4-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼン、1, 4-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼンを好ましい例として挙げることができる。

【0016】本発明において、(A)成分を構成する化合物(1)~(3)としては、上記化合物(1)、(2)および(3)の1種もしくは2種以上を用いることができる。(A)成分を構成する化合物(1)~(3)を加水分解、縮合させる際には、触媒を使用してもよい。この際に使用する触媒としては、金属キレート化合物、有機酸、無機酸、有機塩基、無機塩基を挙げることができる。

【0017】金属キレート化合物としては、例えば、ト リエトキシ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、ト リー n ープロポキシ・モノ (アセチルアセトナート) チ タン、トリーi-プロポキシ・モノ (アセチルアセトナ ート) チタン、トリーnーブトキシ・モノ (アセチルア セトナート) チタン、トリーsecーブトキシ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、トリーtーブトキシ ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、ジエトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジーnープロポ キシ・ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジー i -プロポキシ・ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジ - n - ブトキシ・ビス (アセチルアセトナート) チタ ン、ジーsec-ブトキシ・ビス (アセチルアセトナー ト) チタン、ジー セーブトキシ・ビス (アセチルアセト ナート) チタン、モノエトキシ・トリス (アセチルアセ トナート) チタン、モノー n ープロポキシ・トリス (ア セチルアセトナート) チタン、モノー i ープロポキシ・ トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノー n ーブ トキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノ -sec-ブトキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノー t ーブトキシ・トリス (アセチルアセト ナート) チタン、テトラキス (アセチルアセトナート) チタン、トリエトキシ・モノ (エチルアセトアセテー ト) チタン、トリーnープロポキシ・モノ (エチルアセ トアセテート) チタン、トリーi-プロポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリーカーブトキ シ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリーS e c - ブトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタ ン、トリーt-ブトキシ・モノ (エチルアセトアセテー ト) チタン、ジエトキシ・ビス (エチルアセトアセテー ト) チタン、ジー n ープロポキシ・ビス (エチルアセト

アセテート) チタン、ジー i -プロポキシ・ビス (エチ ルアセトアセテート) チタン、ジーn-ブトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジーsecーブト キシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジー t ーブトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、 モノエトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) チタ ン、モノーnープロポキシ・トリス (エチルアセトアセ テート) チタン、モノーi-プロポキシ・トリス (エチ ルアセトアセテート) チタン、モノー n ーブトキシ・ト リス (エチルアセトアセテート) チタン、モノーsec ーブトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) チタ ン、モノー t ーブトキシ・トリス (エチルアセトアセテ ート) チタン、テトラキス (エチルアセトアセテート) チタン、モノ (アセチルアセトナート) トリス (エチル アセトアセテート) チタン、ビス (アセチルアセトナー ト) ビス (エチルアセトアセテート) チタン、トリス (アセチルアセトナート) モノ (エチルアセトアセテー ト) チタンなどのチタンキレート化合物;

【0018】トリエトキシ・モノ (アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、トリーnープロポキシ・モノ (アセ チルアセトナート) ジルコニウム、トリーi -プロポキ シ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、トリ -n-ブトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコ ニウム、トリーsecーブトキシ・モノ (アセチルアセ トナート) ジルコニウム、トリー t ーブトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジエトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジーn-プロポキシ・ビス(アセチルアセトナート)ジルコニウ ム、ジー i -プロポキシ・ビス (アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、ジー n ー ブトキシ・ビス (アセチル アセトナート) ジルコニウム、ジーsec-ブトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジーt-ブトキシ・ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、モノエトキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジ ルコニウム、モノー n ープロポキシ・トリス (アセチル アセトナート) ジルコニウム、モノー i ープロポキシ・ トリス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、モノー n-ブトキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコ ニウム、モノーsecーブトキシ・トリス (アセチルア セトナート) ジルコニウム、モノー t ーブトキシ・トリ ス(アセチルアセトナート)ジルコニウム、テトラキス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、トリエトキシ ・モノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリ -n-プロポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジ ルコニウム、トリーi-プロポキシ・モノ (エチルアセ トアセテート) ジルコニウム、トリーnーブトキシ・モ ノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリーs e c - ブトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジル コニウム、トリーセーブトキシ・モノ (エチルアセトア セテート) ジルコニウム、ジエトキシ・ビス (エチルア

セトアセテート) ジルコニウム、ジーn-プロポキシ・ ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、ジーi -プロポキシ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコ ニウム、ジーn-ブトキシ・ビス (エチルアセトアセテ ート) ジルコニウム、ジーsecーブトキシ・ビス (エ チルアセトアセテート) ジルコニウム、ジーセーブトキ シ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モ ノエトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) ジルコ ニウム、モノー n ープロポキシ・トリス (エチルアセト アセテート) ジルコニウム、モノー i -プロポキシ・ト リス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノー n-プトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) ジル コニウム、モノーsec-ブトキシ・トリス (エチルア セトアセテート) ジルコニウム、モノー t ーブトキシ・ トリス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、テト ラキス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノ (アセチルアセトナート) トリス (エチルアセトアセテ ート) ジルコニウム、ビス (アセチルアセトナート) ビ ス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリス (アセチルアセトナート) モノ (エチルアセトアセテー ト) ジルコニウムなどのジルコニウムキレート化合物; 【0019】トリス (アセチルアセトナート) アルミニ ウム、トリス (エチルアセトアセテート) アルミニウム などのアルミニウムキレート化合物; などを挙げること ができる。

【0020】有機酸としては、例えば、酢酸、プロピオ ン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘキサン酸、ヘプタン 酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、シュウ酸、マレ イン酸、メチルマロン酸、アジピン酸、セバシン酸、没 食子酸、酪酸、メリット酸、アラキドン酸、シキミ酸、 2-エチルヘキサン酸、オレイン酸、ステアリン酸、リ ノール酸、リノレイン酸、サリチル酸、安息香酸、p-アミノ安息香酸、p-トルエンスルホン酸、ベンゼンス ルホン酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ 酢酸、トリフルオロ酢酸、ギ酸、マロン酸、スルホン 酸、フタル酸、フマル酸、クエン酸、酒石酸などを挙げ ることができる。無機酸としては、例えば、塩酸、硝 酸、硫酸、フッ酸、リン酸などを挙げることができる。 【0021】有機塩基としては、例えば、ピリジン、ピ ロール、ピペラジン、ピロリジン、ピペリジン、ピコリ ン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、モノエタノ ールアミン、ジエタノールアミン、ジメチルモノエタノ ールアミン、モノメチルジエタノールアミン、トリエタ ノールアミン、ジアザビシクロオクラン、ジアザビシク ロノナン、ジアザビシクロウンデセン、テトラメチルア ンモニウムハイドロオキサイド、尿素、クレアチニンな どを挙げることができる。無機塩基としては、例えば、 アンモニア、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸 化バリウム、水酸化カルシウムなどを挙げることができ る。

【0022】これら触媒のうち、金属キレート化合物、有機酸、無機酸が好ましく、より好ましくは、有機酸を挙げることができる。有機酸としては、特に酢酸、シュウ酸、マレイン酸、マロン酸が好ましい。触媒として、有機酸を用いると、加水分解および縮合反応中のポリマーの析出やゲル化の恐れが少なく好ましい。これらの触媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。上記触媒の使用量は、化合物(1)~(3)中のR10基の総量1モルに対して、通常、0.0001~0.01モルである。(A)成分が、化合物(1)~(3)の縮合物である場合には、その分子量は、ポリスチレン換算の重量平均分子量で、通常、500~300,000、好ましくは、700~200,000、さらに好ましくは1,000~100,000程度である。

【0023】また、(A)成分中、各成分を完全加水分 解縮合物に換算したときに、化合物(3)が化合物 (1)、化合物(2)および化合物(3)の総量に対し て5~60重量%、好ましくは5~50重量%、さらに 好ましくは5~40重量%であり、かつ〔化合物(1) の重量〕 <〔化合物(2)の重量〕である。完全加水分 解縮合物に換算した各成分の割合で、化合物(3)が化 合物(1)~化合物(3)の総量の5重量%未満では、 得られる塗膜の機械的強度が低下し、一方、60重量% を超えると、吸水性が高くなり電気的特性が低下する。 また、化合物(1)の重量が化合物(2)の重量以上で あると、得られる塗膜の強度が劣る。なお、本発明にお いて、完全加水分解縮合物とは、化合物(1)~(3) のSiOR1基が100%加水分解してSiOH基とな り、さらに完全に縮合してシロキサン構造となったもの をいう。

【0024】本発明において無機系絶縁膜層は、上記シラン化合物の加水分解、縮合物を(B)有機溶媒に溶解した塗布液を塗布し、加熱することにより形成することが好ましい。

(B) 有機溶媒としては、アルコール系溶媒、ケトン系溶媒、アミド系溶媒、エステル系溶媒および非プロトン系溶媒の群から選ばれた少なくとも1種が挙げられる。ここで、アルコール系溶媒としては、メタノール、エタノール、ロープロパノール、iープロパノール、ローブタノール、iーブタノール、iーブタノール、iーブタノール、iーブタノール、iーペンタノール、2ーメチルブタノール、secーペンタノール、ローペンタノール、2ーメチルペンタノール、secーペプタノール、ヘプタノールー3、ローオクタノール、2ーエチルペキサノール、secーオクタノールー4、ローデカノール、secーウンデシルアルコール、トリメチルノニルアル

コール、sec-テトラデシルアルコール、sec-ヘプタデシルアルコール、フェノール、シクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノール、3,3,5-トリメチルシクロヘキサノール、ベンジルアルコール、ジアセトンアルコールなどのモノアルコール系溶媒;

【0025】エチレングリコール、1,2-プロピレン グリコール、1,3-ブチレングリコール、ペンタンジ オールー2, 4、2-メチルペンタンジオールー2. 4、ヘキサンジオールー2、5、ヘプタンジオールー 2,4、2-エチルヘキサンジオール-1,3、ジエチ レングリコール、ジプロピレングリコール、トリエチレ ングリコール、トリプロピレングリコールなどの多価ア ルコール系溶媒; エチレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレン グリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコール モノブチルエーテル、エチレングリコールモノヘキシル エーテル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、 エチレングリコールモノ-2-エチルブチルエーテル、 ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレン グリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコール モノプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブチ ルエーテル、ジエチレングリコールモノヘキシルエーテ ル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピ レングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコ ールモノプロピルエーテル、プロピレングリコールモノ ブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエ ーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、 ジプロピレングリコールモノプロピルエーテルなどの多 価アルコール部分エーテル系溶媒; などを挙げることが できる。これらのアルコール系溶媒は、1種あるいは2 種以上を同時に使用してもよい。

【0026】これらアルコールのうち、nープロパノール、iープロパノール、nーブタノール、iーブタノール、nーペンタノール、iーペンタノール、tーベンタノール、3ーメトキシブタノール、nーへキサノール、2ーメチルペンタノール、secーヘキサノール、2ーエチルブタノール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノブロピルエーテル、プロピレングリコールモノブロピルエーテル、プロピレングリコールモノブロピルエーテル、プロピレングリコールモノブロビルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテルなどが好ましい。

【0027】ケトン系溶媒としては、アセトン、メチルエチルケトン、メチルーnープロピルケトン、メチルーnーブチルケトン、ジエチルケトン、メチルーiーブチルケトン、メチルーnーペンチルケトン、エチルーnーブチルケトン、メチルーnーへキシルケトン、ジーiーブチルケトン、トリメチルノナノン、シクロヘキサノン、2ーヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、2,4ーペンタンジオン、アセトニルアセトン、アセトフェノ

ン、フェンチョンなどのほか、アセチルアセトン、2、 $4-\Lambda$ キサンジオン、2、 $4-\Lambda$ プタンジオン、3、 $5-\Lambda$ プタンジオン、2, $4-\Lambda$ プタンジオン、3, $5-\Lambda$ グタンジオン、 $4-\Lambda$ グランジオン、 $4-\Lambda$ グランジオン、 $4-\Lambda$ グランジオン、 $4-\Lambda$ グランジオンなどの $4-\Lambda$ グラングオンなどの $4-\Lambda$ グランググ

【0028】アミド系溶媒としては、ホルムアミド、Nーメチルホルムアミド、N, Nージメチルホルムアミド、Nーエチルホルムアミド、N, Nージエチルホルムアミド、Nーエチルアセトアミド、N, Nージメチルアセトアミド、Nーエチルアセトアミド、Nージメチルアセトアミド、Nーメチルプロピオンアミド、Nーメチルピロリドン、Nーホルミルセロリジン、Nーホルミルピロリジン、Nーアセチルピロリジンなどが挙げられる。これらアミド系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0029】エステル系溶媒としては、ジエチルカーボ ネート、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、炭酸ジエチ ル、酢酸メチル、酢酸エチル、γ-ブチロラクトン、_γ ーバレロラクトン、酢酸n-プロピル、酢酸i-プロピ ル、酢酸n-ブチル、酢酸i-ブチル、酢酸sec-ブ チル、酢酸nーペンチル、酢酸sec-ペンチル、酢酸 3-メトキシブチル、酢酸メチルペンチル、酢酸2-エ チルブチル、酢酸2-エチルヘキシル、酢酸ベンジル、 酢酸シクロヘキシル、酢酸メチルシクロヘキシル、酢酸 n-ノニル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、酢 酸エチレングリコールモノメチルエーテル、酢酸エチレ ングリコールモノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリ コールモノメチルエーテル、酢酸ジエチレングリコール モノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノー nーブチルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノメ チルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノエチルエ ーテル、酢酸プロピレングリコールモノプロピルエーテ ル、酢酸プロピレングリコールモノブチルエーテル、酢 酸ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸ジ プロピレングリコールモノエチルエーテル、ジ酢酸グリ コール、酢酸メトキシトリグリコール、プロピオン酸エ チル、プロピオン酸n-ブチル、プロピオン酸i-アミ ル、シュウ酸ジエチル、シュウ酸ジーn-ブチル、乳酸 メチル、乳酸エチル、乳酸n-ブチル、乳酸n-アミ ル、マロン酸ジエチル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジ エチルなどが挙げられる。これらエステル系溶媒は、1 種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0030】非プロトン系溶媒としては、アセトニトリ

ル、ジメチルスルホキシド、N, N, N , N ーテトラエチルスルファミド、ヘキサメチルリン酸トリアミド、Nーメチルモルホロン、Nーメチルピロール、Nーエチルピロール、NーメチルーΔ3ーピロリン、N, Nージメチルピペリジン、Nーエチルピペリジン、N, Nージメチルピペラジン、Nーメチルイミダゾール、Nーメチルー4ーピペリドン、Nーメチルー2ーピペリドン、1, 3ージメチルー2ーピペリドン、1, 3ージメチルー2ーイミダゾリジノン、1, 3ージメチルテトラヒドロー2(1H)ーピリミジノンなどを挙げることができる。以上の(B)有機溶媒は、1種あるいは2種以上を混合して使用することができる。

【0031】上記の有機溶剤のなかではアルコール系溶 媒が好ましい。このような塗布液の塗布方法としては、 スピンコート、ディッピング、ローラーブレードなどが 挙げられる。この際の膜厚は、乾燥膜厚として、1回塗 りで厚さ0.05~1.5μm程度、2回塗りでは厚さ 0.1~3μm程度の塗膜を形成することができる。形 成する塗膜の厚さは、通常、O. 2~20μmである。 この際の加熱方法としては、ホットプレート、オーブ ン、ファーネスなどを使用することができ、加熱雰囲気 としては、大気下、窒素雰囲気、アルゴン雰囲気、真空 下、酸素濃度をコントロールした減圧下などで行なうこ とができる。また、上記の(A)成分の硬化速度を制御 するため、必要に応じて、段階的に加熱したり、窒素、 空気、酸素、減圧などの雰囲気を選択することができ る。このようにして得られるシリカまたはシロキサン系 膜は、膜密度が、比誘電率が1.5~3.2、通常、0.35 ~1.2g/cm³、好ましくは0.4~1.1g/c m^3 、さらに好ましくは $0.5\sim1.0$ g/ cm^3 であ る。膜密度が0.35g/cm3 未満では、塗膜の機械 的強度が低下し、一方、1.2g/cm3 を超えると低 比誘電率が得られない。などが挙げられる。本発明にお いて、無機系絶縁膜としては上記のシラン化合物をCV D法により蒸着する膜も使用することができる。

【0032】有機系絶縁膜

有機系絶縁膜としてはガラス転移点が400℃以上、熱分解温度が500℃以上の耐熱有機樹脂がこの好ましい。本発明では、有機系絶縁膜は配線工程において除去することなく、積層構造の中に残存するので、ガラス転移点が400℃未満であると多層配線時に変形を起こし、配線の接続不良や層間剥離などの問題を起すので好ましくない。

【0033】また、有機系絶縁膜は、比誘電率が4.0以下であることが好ましく、さらには、比誘電率が3.5以下であることが好ましい。有機系絶縁膜の膜厚は、無機系絶縁膜の膜厚およびエッチング時の無機系絶縁膜とのエッチ選択比で決まるが、通常10nm~2000nmの範囲である。有機系絶縁膜としては、ポリアリーレン、ポリアリーレンエーテル、ポリベンゾオキサゾール、ポリイミ

ドより選ばれる有機ポリマーであることが好ましい。これらの有機系絶縁膜は、有機ポリマーは有機溶剤に溶解し、塗布し、加熱することにより形成することができる。有機ポリマーを含む塗布液の成膜条件は、50~600℃、好ましくは200~500℃の温度で焼成することが好ましい。

【0034】本発明において金属酸化物膜は、金属アルコキシドの加水分解縮合物である。金属アルコキシドに含まれる金属元素としてはB, Al, Ga, In, Tl, Si, Ge, Sn, Pb, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Mn, Zn, Cd, P, As, Sb, Bi, Ceより選ばれる少なくとも一種類である。

【0035】これらの中でも、金属アルコキシドがアル コキシシランであることが好ましい。アルコキシシラン としては、無機系絶縁膜を形成するために用いるシラン 化合物と同様のものを挙げることができる。金属酸化物 膜はシラン化合物の加水分解縮合物を有機溶剤に溶解し た塗布液を塗布し、加熱することにより形成することが できる。本発明において、酸発生剤としては、潜在性熱 酸発生剤、潜在性光酸発生剤を挙げることができる。本 発明で用いられる潜在性熱酸発生剤は、通常50~45 0℃、好ましくは200~350℃に加熱することによ り酸を発生する化合物であり、スルホニウム塩、ベンゾ チアゾリウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩など のオニウム塩が用いられ、潜在性光酸発生剤は、通常1 ~100mJ、好ましくは10~50mJの紫外光照射 により酸を発生する化合物である。。シラン化合物の加 水分解縮合物を主成分する塗布液の塗膜の加熱温度は80 ℃~450の温度が好ましい。この金属酸化物膜形成用塗 布液には、有機系絶縁膜に形成したトレンチマスクパタ ーンに埋め込め、かつ平坦化表面を形成する機能が必要 である。この金属酸化物膜上には、フォトリソグラフィ ーのために反射防止膜その上層にフォトレジストが塗布 されるが、金属酸化物膜に反射防止機能を付与し、反射 防止膜塗布工程を省略することも可能である。

【0036】本発明のデュアルダマシン構造の形成方法の代表例は下記のとおりである。

1. 積層構造の形成工程

デュアルダマシン構造を形成すべき基板上に、無機系絶縁膜、有機系絶縁膜および金属酸化物膜を形成し、図1に示すような積層構造とする。このとき、無機系絶縁膜、有機系絶縁膜、無機系絶縁膜、有機系絶縁膜および金属酸化物膜の順に積層すると、図2に示すような無機系絶縁膜内にミッドエッチストッパー層を形成することができる。

- 2. トレンチパターンフォトリソ工程
- 3. 金属酸化膜へのトレンチパターンの転写工程
- 4. 有機絶縁膜へのトレンチパターン転写工程
- 5. 金属酸化膜による有機絶縁膜トレンチパターンマス クの溝埋め込み、平坦化工程

- 6. ビアパターンフォトリソ工程
- 7. トレンチ層へのビアパターン転写工程
- 8. ミッドエッチストッパーへのピアパターン転写工程 (任意工程)
- 9. ビア形成工程
- 10. トレンチ形成工程
- 11. 銅バリアー層(CVD法による炭化珪素、窒化珪素膜)プレイク工程バリアメタル形成および銅配線埋め込み工程

12. 銅のCMPスラリーによる研磨工程

上記工程4は、有機系絶縁膜へのトレンチパターン転写 工程であるが、有機系絶縁膜のトレンチマスクパターン のエッチングとフォトレジストのアッシングの2つの工 程を兼ねている。この際に、有機系絶縁膜上に金属酸化 物膜を形成しておくと、フォトレジストのアッシング時 のストッパー膜として機能し、有機系絶縁膜層とフォト レジストパターンのエッチング比を機にせずにプロセス できるので好ましい。上記工程7は、金属酸化物膜がシ リカ膜であると、金属酸化物膜から無機系絶縁膜へのエ ッチングへ移行する際にガス組成を大きく変化させるこ と無くエッチングができるので好ましい。上記程8は、 ミッドエッチストッパーとして機能する有機系絶縁膜へ ビアパターンを転写する工程であるが、このミッドエッ チストッパーは、本発明では必須ではない。しかし、実 際のデュアルダマシン構造形成にておいて、ミッドエッ チストッパー無しでトレンチ層とビア層の厚みを厳密に 制御しようとする場合、エッチングガスによるエッチン グレート、マスクと絶縁膜層とのエッチング選択比を精 密にコントロールする必要があり、ミッドエッチストッ パーを用いる事で全てのコントロールパラメーターを厳 密にマッチングさせる必要を無くする事ができるので有 用である。

【0037】上記工程9は、トレンチ層のエッチング工程であるが、下層ビアエッチングを進めるにしたがって金属酸化物膜が完全に除去されその金属酸化物膜の下層にあった有機絶縁膜のトレンチマスクが現れる。このトレンチマスクパターンを無機系絶縁膜のトレンチ層へ転写させることにより、デュアルダマシン構造が形成できる。有機絶縁膜は、工程12における銅CMPプロセスにてCMPストッパーとして機能することが好ましい。一般に無機系絶縁膜および金属酸化物膜のエッチングには、フルオロカーボンガスを主成分とするドライエッチングプロセスが用いられる。また、有機系絶縁膜のエッチングおよびフォトレジストのアッシングには、酸素プラズマ、アンモニアプラズマ、水素/窒素混合ガズプラズマ、または窒素/酸素混合ガスを主成分とするドライエッチングプロセスが用いられる。

[0038]

【実施例】以下、本発明を実施例を挙げてさらに具体的 に説明する。ただし、以下の記載は、本発明の態様例を 概括的に示すものであり、特に理由なく、かかる記載により本発明は限定されるものではない。なお、実施例および比較例中の部および%は、特記しない限り、それぞれ重量部および重量%であることを示している。

合成例1 無機系絶縁膜用塗布液

25%アンモニア水溶液5g、超純水320gおよびエタノール600gの混合溶液中にメチルトリメトキシシラン15g(完全加水分解縮合物換算7.4g)とテトラエトキシシラン20g(完全加水分解縮合物換算5.8g)を加え60℃で3時間反応をさせたのち、マレイン酸を添加しpH=2.5とした。この溶液にプロピレングリコールモノプロピルエーテル150gを加え、その後、減圧下で濃縮し、固形分含有量9%の組成物溶液を得た。

【0039】合成例2 有機系絶縁膜用塗布液

9,9-ビス(4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル) フルオレン37.8gと炭酸カリウム37.8gをジメ チルアセトアミド350gと共にフラスコに入れ、窒素 雰囲気下で150℃で2時間加熱を行った。この際、発 生する水蒸気を系外に除去した。この溶液にビス(4-フルオロフェニル)ケトン21.8gを添加し、165 ℃で10時間反応を行った。反応液を冷却したのち、溶 液中の不溶物をろ過で除去し、メタノール中に再沈殿を 行った。この沈殿物をイオン交換水で十分洗浄したの ち、沈殿物をシクロヘキサノンに溶解させ、不溶物を除 去したのち、メタノール中に再沈殿させた。この沈殿物 を60℃の真空オーブン中で24時間乾燥させることで 重合体を得た。重合体2gをシクロヘキサノン18gに 溶解させ0.2μm孔径のポリテトラフルオロエチレン (テフロン(登録商標))製フィルターでろ過を行い有 機系絶縁膜用塗布液を得た。

合成例3 金属酸化物膜形成用塗布液の調整

(1) テトラメトキシシラン106.4gをプロピレングリコールモノプロピルエーテル298gに溶解させた後、スリーワンモーターで攪拌させ、溶液温度を60℃に安定させた。次にマレイン酸2.1gを溶解させたイオン交換水50gを1時間かけて溶液に添加した。その後、60℃で4時間反応させた後、反応液を室温まで冷却した。50℃で反応液からメタノールを含む溶液を90gエバポレーションで除去したのち、プロピレングリコールモノプロピルエーテル643gを加えて溶液(A)を得た。

(2)溶液(A)に、(B)成分として、ビス(4-tーブチルフェニル)ヨードニウムカンファースルホネート5gを加え0.2μm孔径のテフロン製フィルターで ア過して金属酸化物膜形成用塗布液を得た。

【0040】実施例1

(1) シリコン基板上に400nmの窒化珪素膜を通常のプラズマCVD法により形成した基板上、合成例1で製造した無機系絶縁膜用塗布液をスピンコート法により塗布

し、大気中80℃で5分間、次いで窒素下200℃で5 分間加熱したのち、さらに真空下425℃で1時間加熱 しすることにより膜厚300nmの無機系絶縁膜からなるビ ア絶縁層(A)を形成した。形成したビア絶縁層をUVオ ゾン処理にて表面を活性化させた後、上記合成例2で製 造した有機系絶縁膜用塗布液をスピンコート法で塗布 し、80℃で1分間、200℃で2分間乾燥し、さらに 450℃の窒素雰囲気で5分基板を加熱し、膜厚50nmの ミッドエッチストッパー層(B)を形成した。形成され たミッドエッチストッパー層に合成例1で得られた無機 系絶縁膜用塗布液(1)を、前記ビア絶縁層の形成と同 様に塗布し加熱して膜厚300nmのトレンチ絶縁層(C)を 形成した。トレンチ絶縁層(c)をUVオゾン処理にて表 面を活性化させた後、有機系絶縁膜塗布液を上記ミッド エッチストッパー層(B)の形成と同様に塗布し、加熱し て膜厚100nmの下層ハードマスク層 (D) を形成した。続 いて、合成例3で製造した金属酸化物膜用塗布液スピン コート法で塗布し、200℃のホットプレートで2分間 乾燥し膜厚30nmの上層ハードマスク層(E)を形成し た。

- (2)次いで、KrFポジ型フォトレジストを用いて0.35mmトレンチパターンレジストマスクを上層ハードマスク層(E)に形成した後、フルオロカーボン系ドライエッチングガスを用いて上層ハードマスク層(E)へトレンチパターンを転写した。
- (3) さらに、NH3ガスプラズマを用いてトレンチパタ ーンを下層ハードマスク層(D) へ転写した。
- (4)ウエット洗浄液(pH=8)を用いてトレンチパターンレジストマスクの残さを除去した。
- (5)次に合成例3で製造した金属酸化物膜用塗布液をトレンチパタンーンが形成された上層ハードマスク層の上に膜厚50nmとなるよう(1)と同様にして塗布、加熱して上層ハードマスク層(E')を形成した。
- (4) KrFポジ型フォトレジストを用いて0.25mホールパターンレジストマスクを上層ハードマスク層(E′)の上に形成した。
- (6)次いでフルオロカーボン系ドライエッチングガス

【図1】





金属酸化物理/上層ハードマスク層有機系統建度/下層ハードマスク層 無機系統建度/ 変化技楽度変化は炭化性素度 総発度 調理 初 を用いて上層ハードマスク(E) へホールパターンを転写、さらに、トレンチ絶縁層(C) までホールパターンを掘り進み、ミッドエッチストッパー層(B) を露出させた。

- (7)続いてNH3ガスプラズマを用いてホールパターンをミッドエッチストッパー層(B)へ転写した。
- (8)もう一度、フルオロカーボン系ドライエッチングガスでビア層(A)へのホール形成を進めるとともに上層ハードマスク(E)を除去していった。引き続き、別のフルオロカーボン系ドライエッチングガスへ切り替え、トレンチ層(C)へ溝形成を行った。
- (9)最後に、下層窒素化珪素膜をフルオロカーボン系ドライエッチングガスにてブレイクし、溝およびホール 形成を終了した。
- (10) 溝およびホールをウエット洗浄薬液(pH8)を用いて洗浄し、エッチングガスによる析出物を除去した。PVD法によりTaバリア金属層1nmを形成、さらにPVD法にて銅シードを層を形成、メッキ法により、ホールおよび溝へ銅配線を埋め込んだ。
- (11)オーバーレイされた銅は、CMPにより除去、さらに、上層のバリアー金属を除去して銅デュアルダマシン配線形成を終了した。
- (12) ウエハー断面を走査型電子顕微鏡にて観察、確かに、銅デュアルダマシン配線が形成されていることを確認した。

[0041]

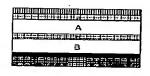
【発明の効果】この様な構成とする事でCVD系炭化珪素、窒化珪素、シリカ膜の組み合わせを用いる場合に問題となるエッチング時の選択比の問題をクリアすることができる。また、絶縁層、ハードマスクを含めてほとんどの材料を塗布系の材料で構成できるので、工程フローを簡略化できるというメリットがある。

【図面の簡単な説明】

【図1】無機系絶縁膜、有機系絶縁膜および金属酸化物膜を有する積層構造を示す。

【図2】無機系絶縁膜内にミッドエッチストッパー層を 有する積層構造を示す。

【図2】



A A B

金属酸化物放/上層ハードマスク層 有機系統約扱/上層ハードマスク層 無機系統約扱/トレンチ総接層 有機系統約扱/ドルエッチストッパー層 無機系統約限/ビア統接層 変化発素規定たは伏化建業数 終報数

フロントページの続き

Fターム(参考) 5F033 HH11 JJ11 JJ21 KK11 KK21

MM02 MM12 MM13 NN06 NN07

PP14 PP27 QQ04 QQ09 QQ11

QQ25 QQ28 QQ37 QQ48 RR01

RR03 RR06 RR09 RR21 RR22

RR25 SS15 SS22 TT04

5F058 AD02 AD04 AD09 AD10 AD12

AF04 AG01 AH02 BC02 BD02

BD04 BD05 BD18 BD19 BE01

BF46 BH01 BJ02